سیویلیکا - ناشر تخصصی مقالات کنفرانس ها و ژورنال ها
گواهی ثبت مقاله در سیویلیکا
CIVILICA.com

عنوان مقاله:

Modeling and control of atomic force microscope for imaging using neural network

محل انتشار:

هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک (سال: 1388)

تعداد صفحات اصل مقاله: 6

نویسندگان:

h babahosseini - *MSc stuent mechanical eng*

s.m yazdian - *MSC student of mechanical eng*

h sayyaadi - *associated professor*

خلاصه مقاله:

Atomic force microscope (AFM) can provide topograhic images of surfaces. Control the vibration behavior of the AFM and make the probe tip track a certain trajectory is important to appropriately scanning.

کلمات کلیدی:

(atomic force microscope(AFM), Non contact mode imaging, neural network (NN

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

https://civilica.com/doc/90854